



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D210097 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 02 月 21 日

(21)申請案號：109303865

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 07 月 15 日

(51)LOC.(11)Cl.：24-01

(30)優先權：2020/06/02 日本

2020-010905

(71)申請人：日商大塚電子股份有限公司 (日本) OTSUKA ELECTRONICS CO., LTD. (JP)
日本

(72)設計人：尾鼻紗耶香 OBANA, SAYAKA (JP)；武川透 TAKEGAWA, TORU (JP)；長沢広也 NAGASAWA, HIROYA (JP)；若山育央 WAKAYAMA, IKUO (JP)；鈴木穂 SUZUKI, MINORU (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

TW D195232

CN 304780548

JP D1629185

US D872603

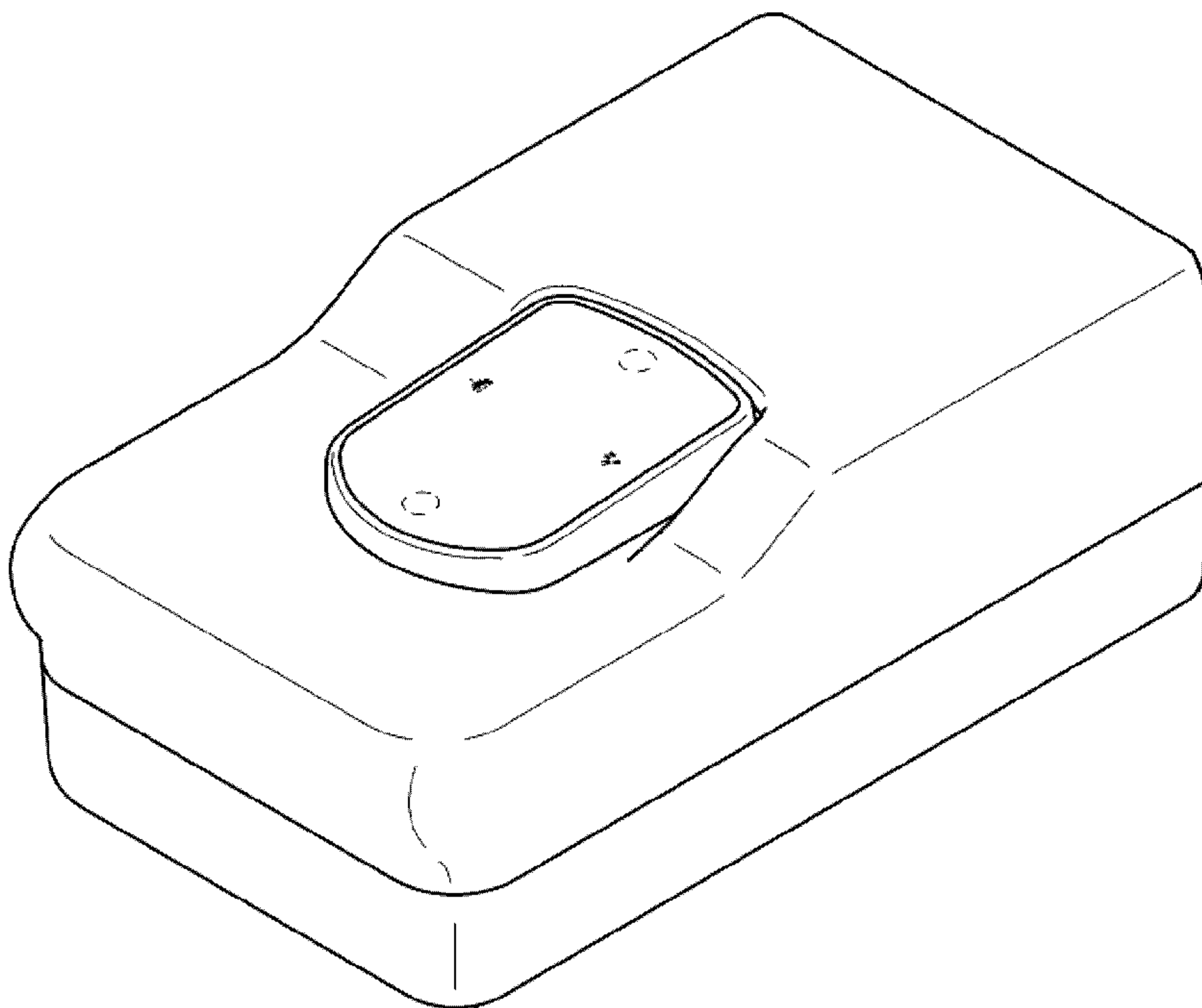
審查人員：謝孟峰

圖式數：10 共 9 頁

(54)名稱

試料分析機之部分

代表圖：



【立體圖】



D210097

【設計說明書】

【中文設計名稱】 試料分析機之部分

【英文設計名稱】 SAMPLE ANALYZER

【物品用途】

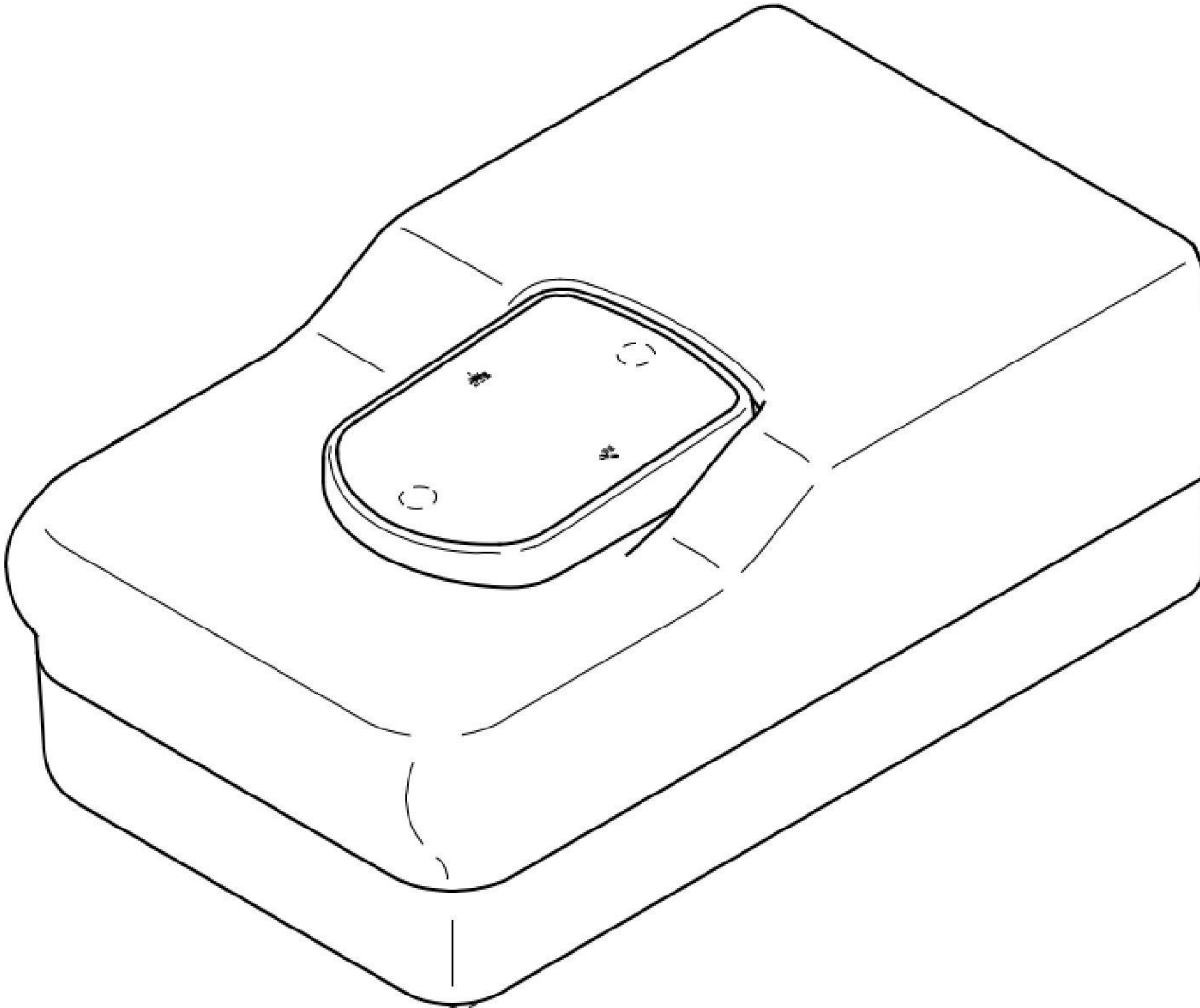
【0001】 本物品是用來分析試料的試料分析機，例如可以用在分析和測量分散在溶液中的膠體粒子的界達電位、粒徑和粒徑分佈以及分子量。使用時，打開位於其主體上表面的開閉蓋，將試料放置在試料分析機中，進行分析和測量。

【設計說明】

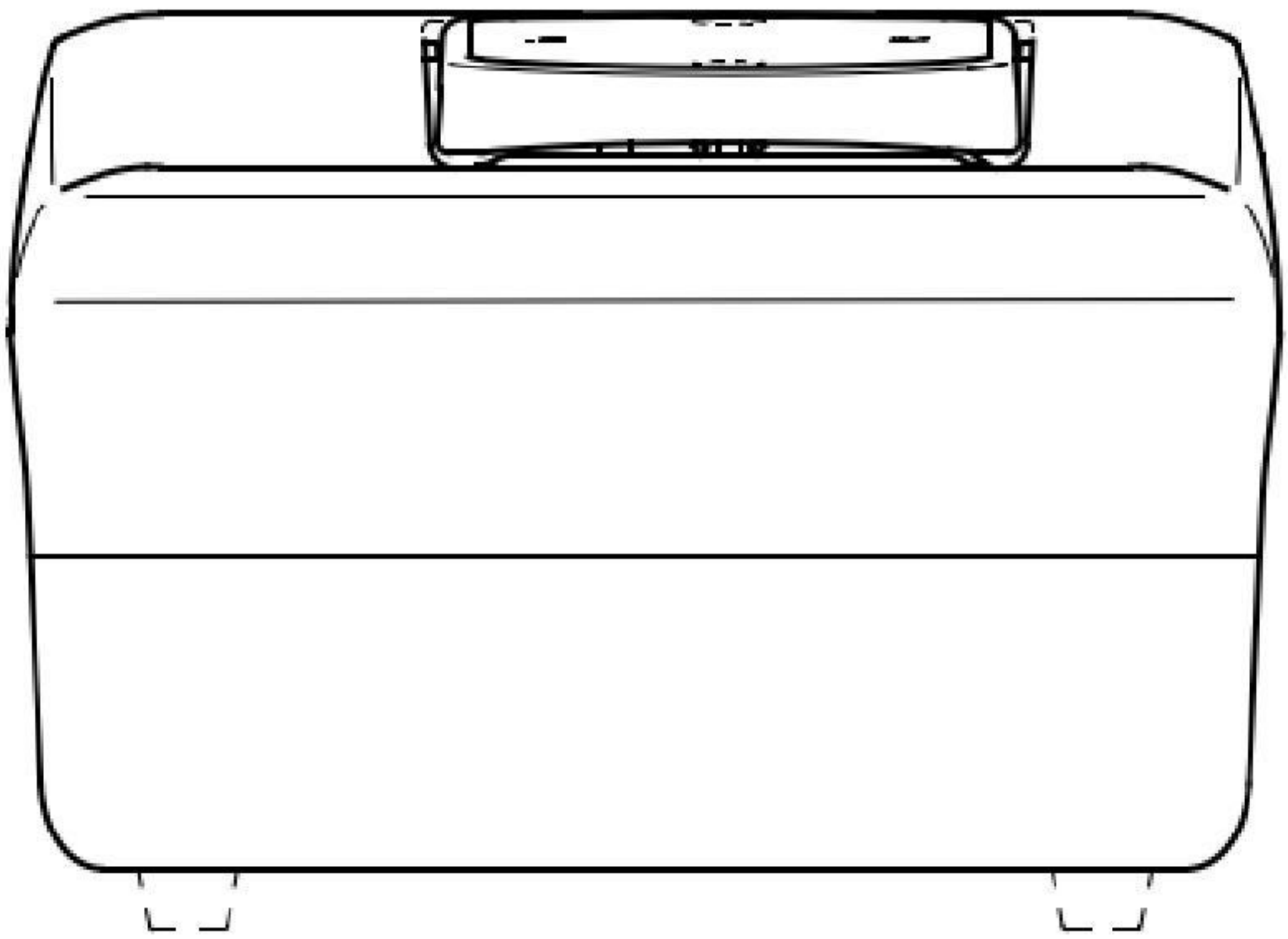
【0002】 圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。

【0003】 各視圖中繪製在物品表面上的細線，是用來呈現立體表面的形狀。

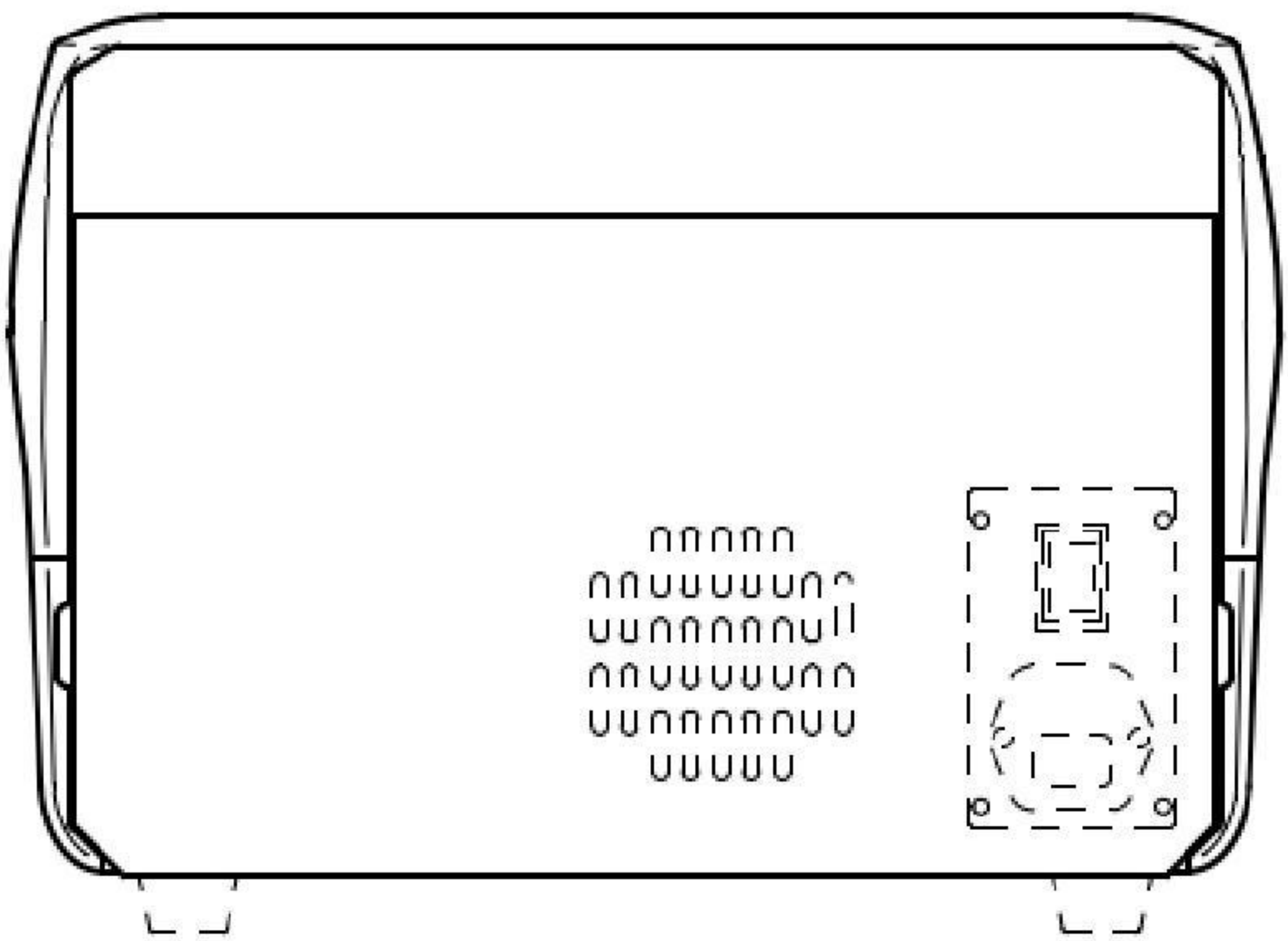
【設計圖式】
(指定代表圖)



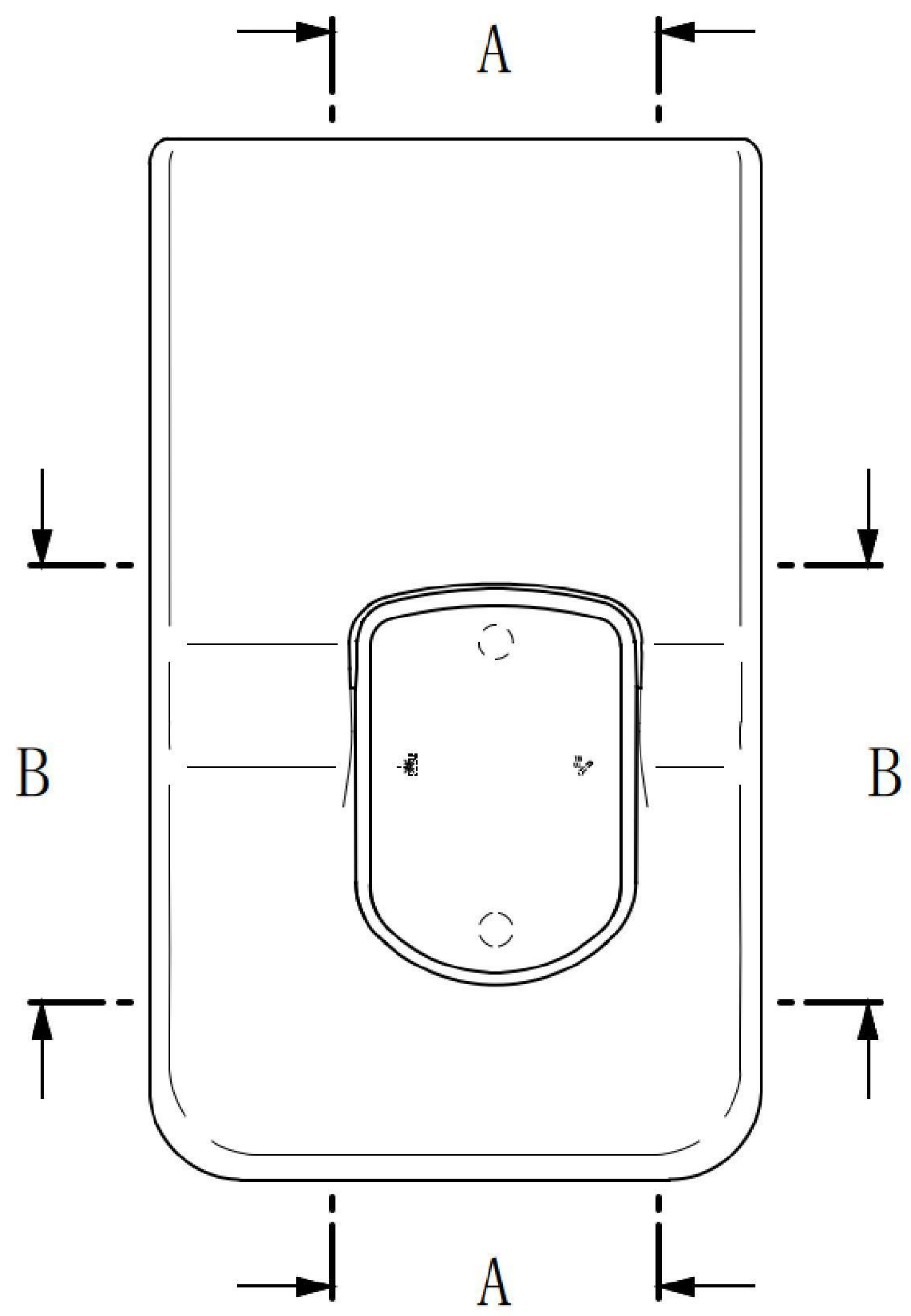
【立體圖】



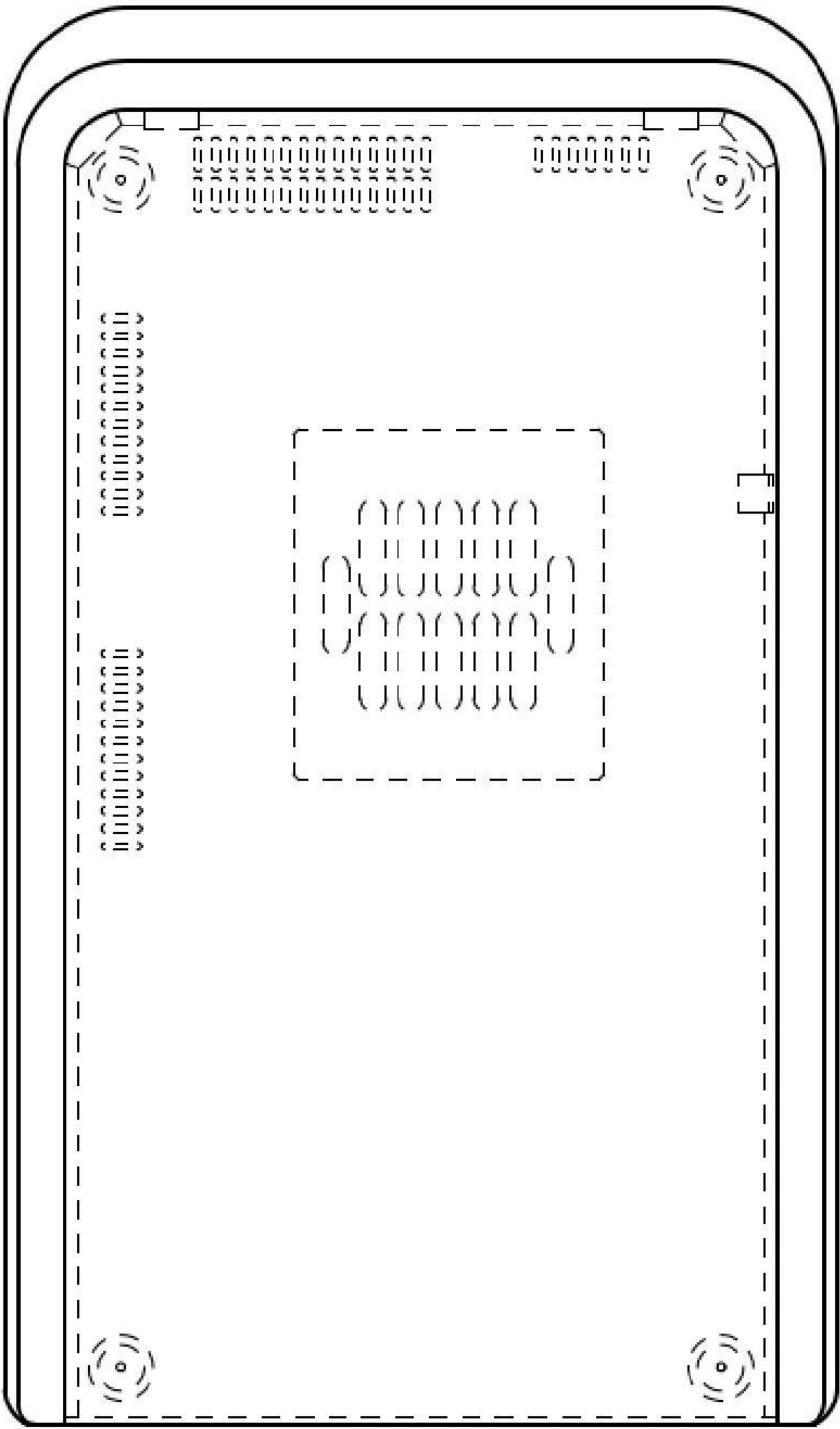
【前 視 圖】



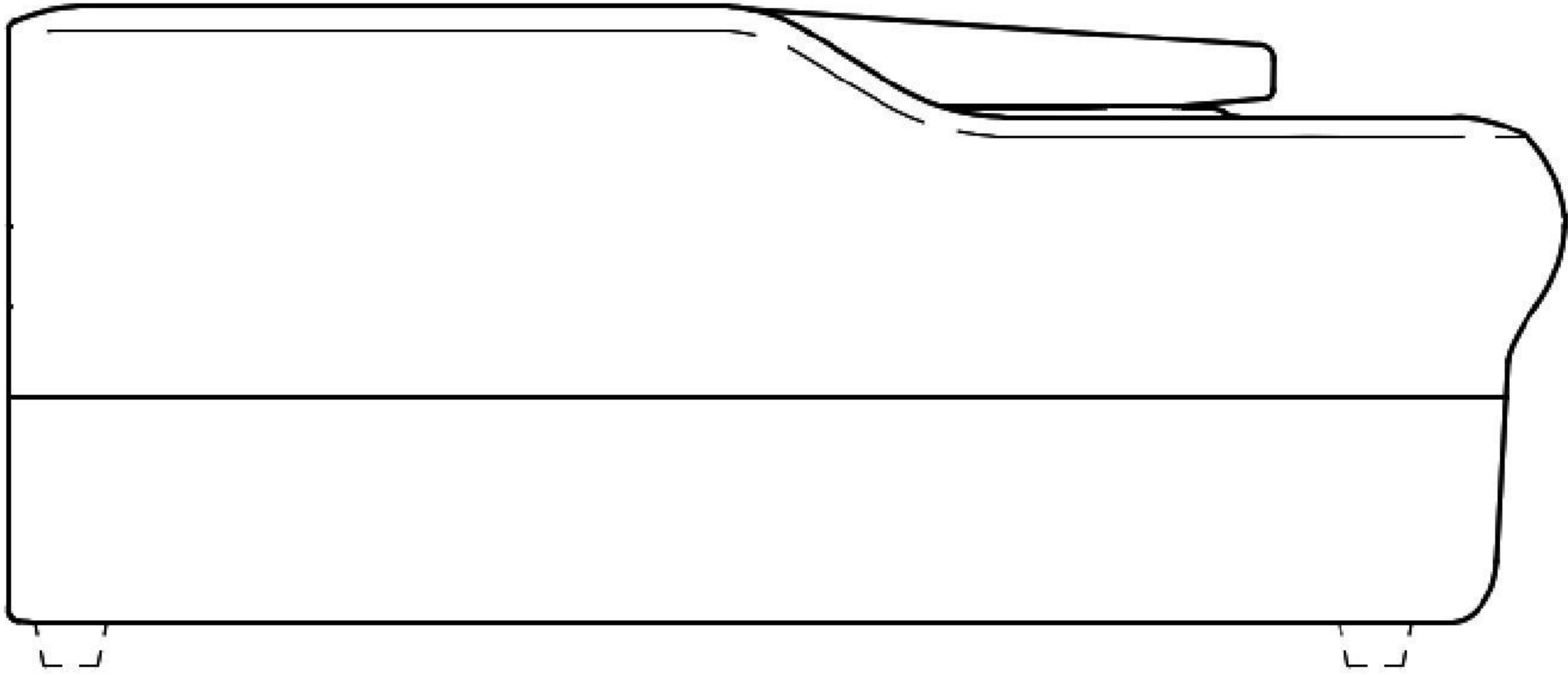
【後 視 圖】



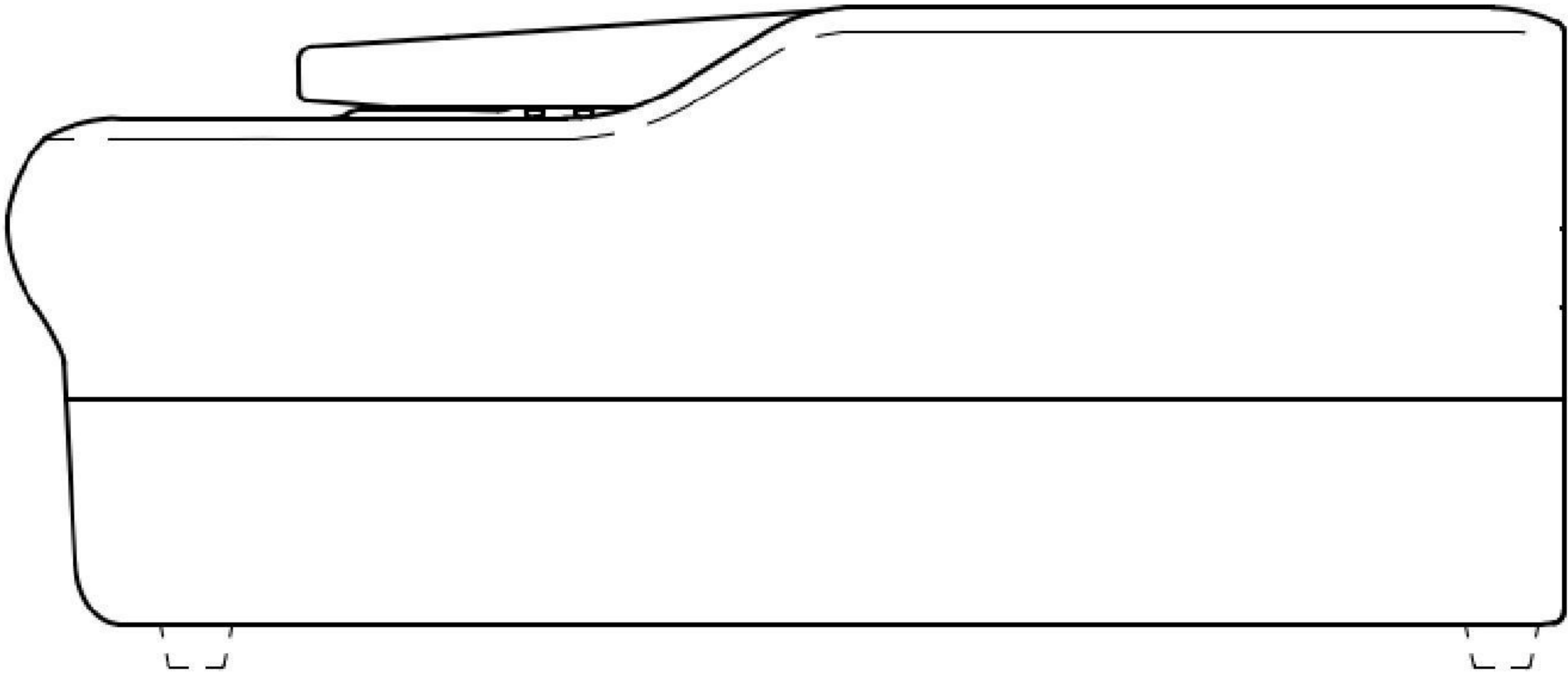
【俯視圖】



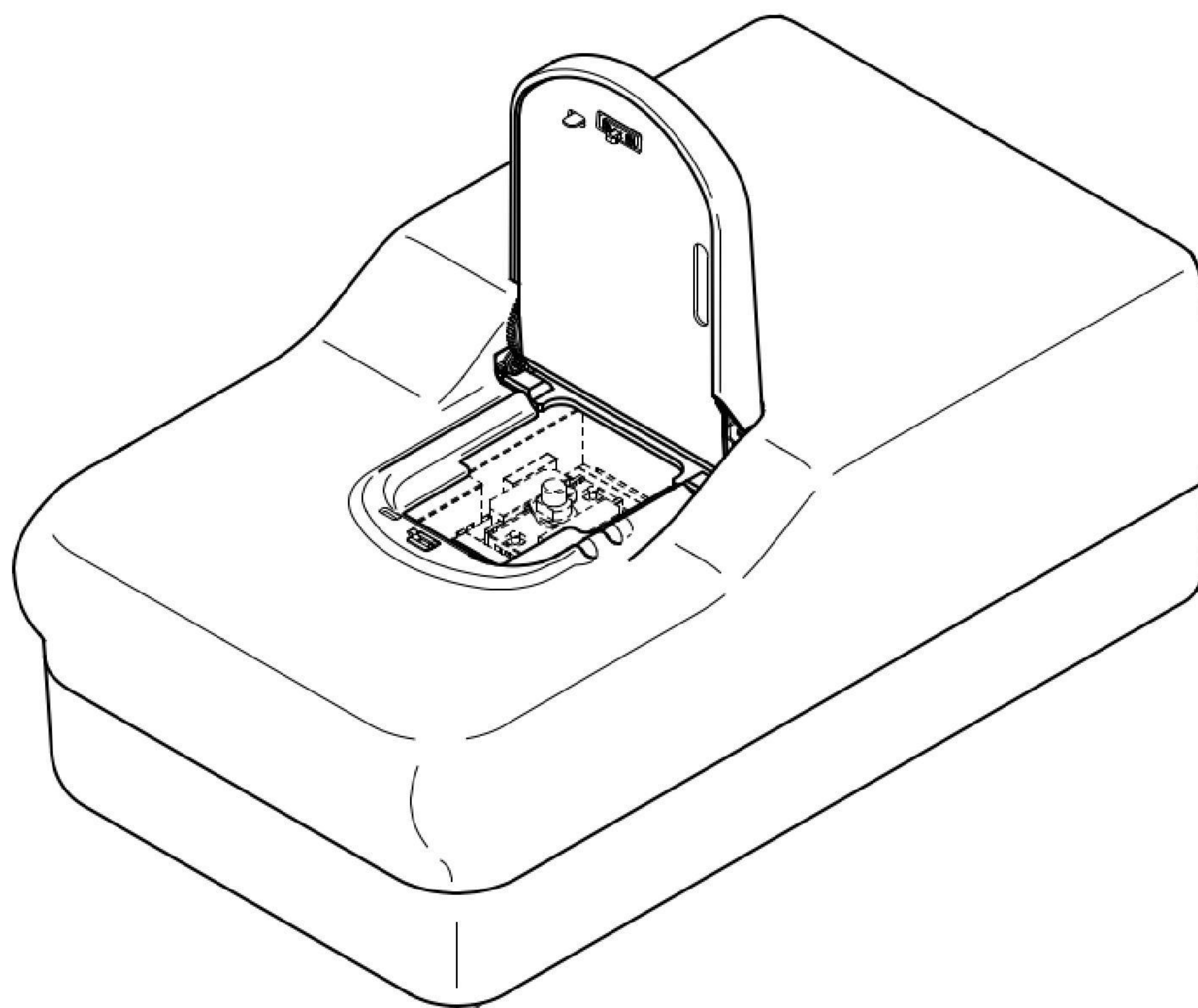
【仰視圖】



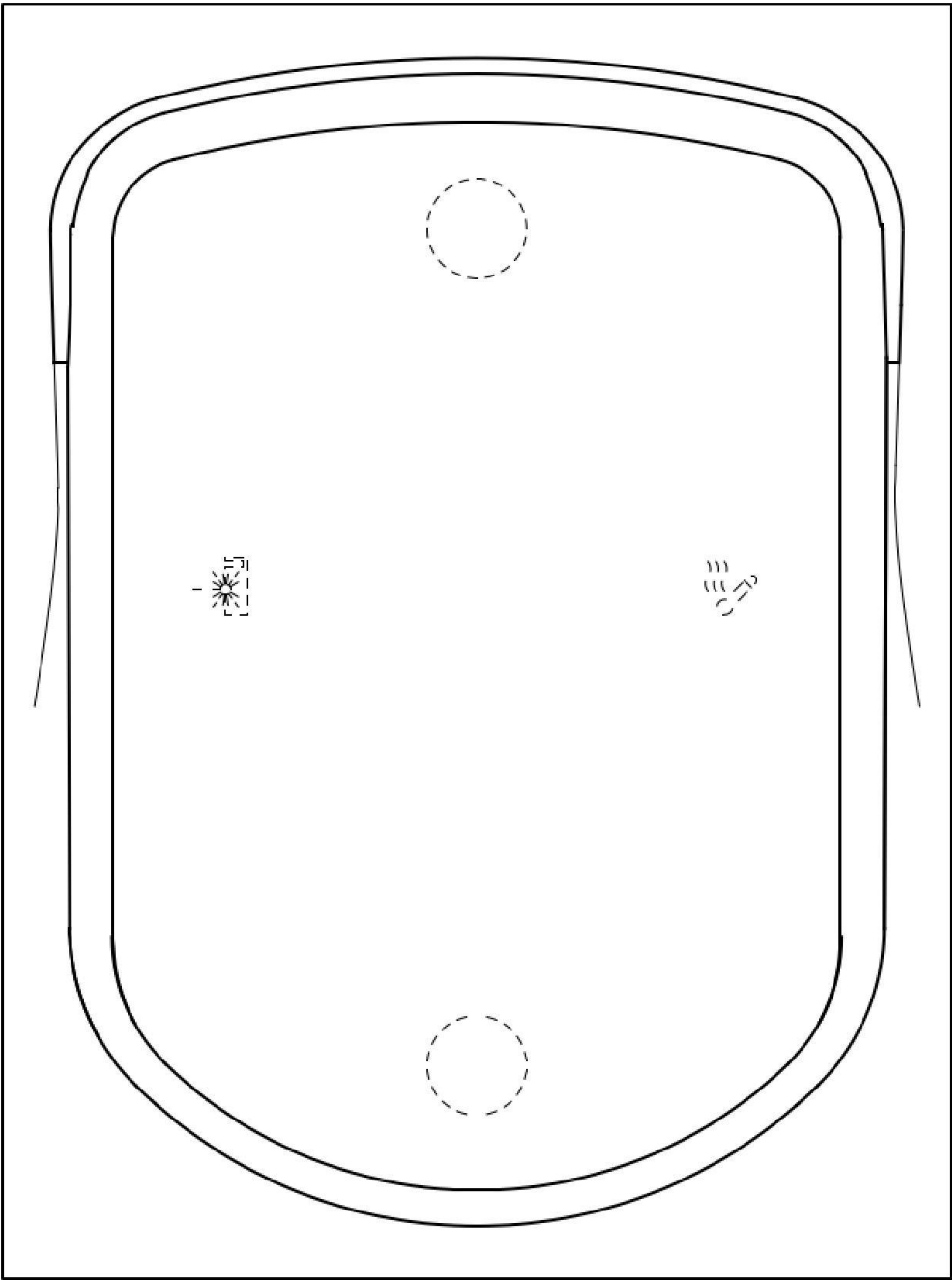
【左側視圖】



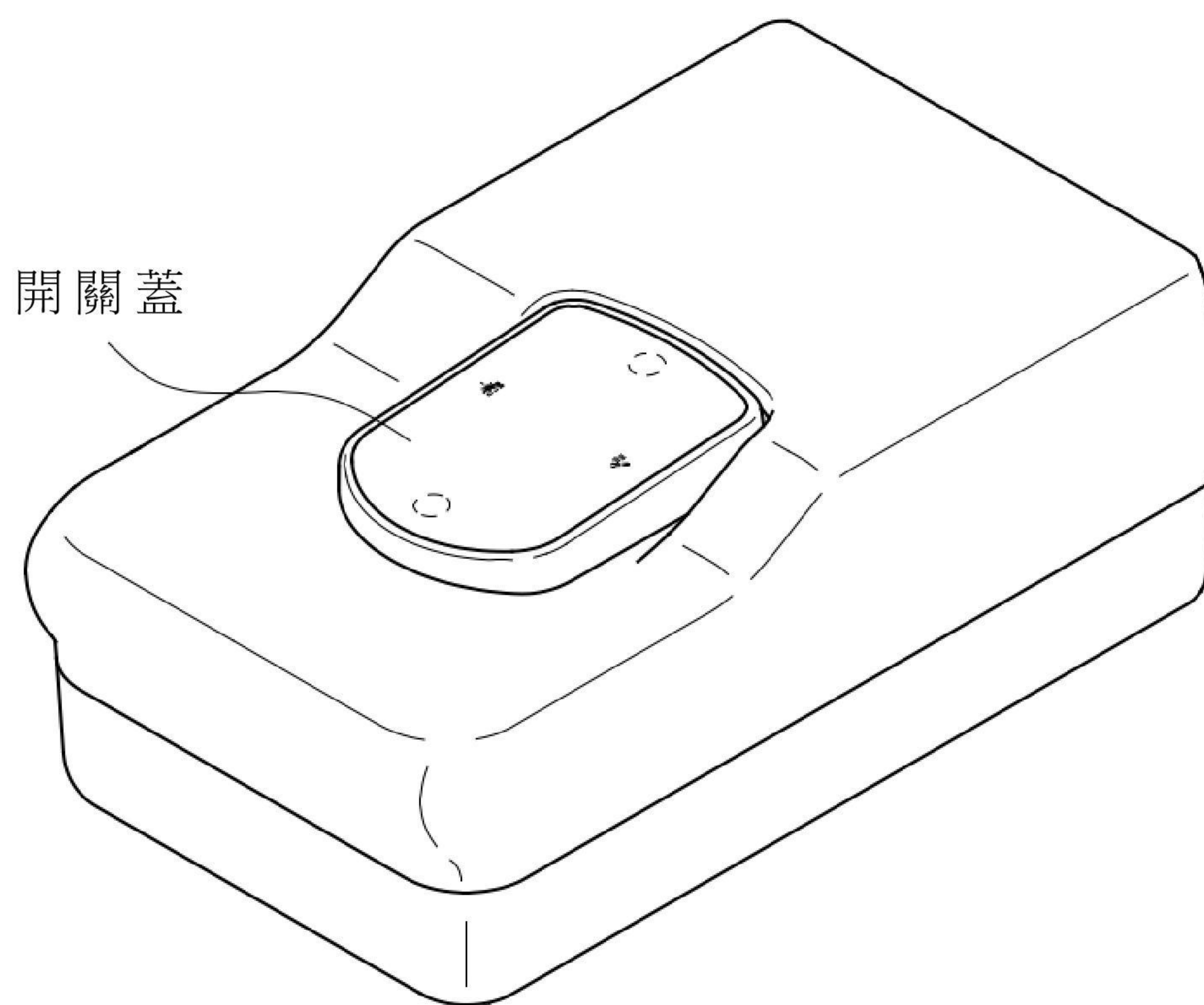
【右側視圖】



【開閉蓋打開狀態立體圖】



【A-B 部分放大圖】



【參考立體圖】